

First edition
2003-07-15

Surface chemical analysis — Secondary-ion mass spectrometry — Method for estimating depth resolution parameters with multiple delta-layer reference materials

Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Méthode d'estimation des paramètres de résolution en profondeur à l'aide de matériaux de référence multicouches minces



Reference number
ISO 20341:2003(E)

© ISO 2003

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn